**Příloha č. 1: Technické podmínky**

SPM mikroskop s možností měření v externím magnetickém poli musí splňovat následující kritéria:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Funkce | Hodnota (minimální požadavky) | Uchazečem nabízené zařízení  (uchazeč uvede příslušnou hodnotu) |
| měřicí módy SPM mikroskopu ve vzduchu | Contact AFM, lateral force microscopy (LFM), Resonant Mode (semicontact, noncontact AFM), Phase Imaging, Magnetic Force Microscopy (MFM), Electric Force Microscopy (EFM), Scanning Kelvin probe microscopy, AFM Litography |  |
| In plane magnet  generované magnetické pole v rovině vzorku o velikosti | minimálně 0,1 T  (pro velikost mezery 15 mm) |  |
| vyměnitelné pólové nádstavce (in-plane magnet) | **Ano** |  |
| Out of plane magnet |  |  |
| generované magnetické pole ve směru kolmém ke vzorku | minimálně 0,01 T |  |
| Oba magnety schopny měřit vzorky | o rozměrech 15x15 mm |  |
| Skener |  |  |
| Rozsah skenování: | alespoň 70x70x7 μm |  |
| Nelinearita v osách xy: | nejvýše 0,2% |  |
| Nelinearita v ose z: | nejvýše 2% |  |
|  |  |  |
| Základna systému SPM a přiblížení vzorku |  |  |
| Automatické i manuální přibližování vzorku | **Ano** |  |
| videomikroskop s manuálním zoomem pro optické rozlišení | minimálně 3 μm |  |
| konektory pro připojení skenerů (měřicích hlav) | **Ano** |  |
|  |  |  |
| SPM kontrolér |  |  |
| kontrola kapacitních senzorů | **Ano** |  |
| počet obrazů zaznamenaných během jednoho skenu | minimálně 4 obrazů |  |
| maximální délka kabelu mezi měřicí hlavou a kontrolerem | minimálně 2 m |  |
| Antivibrační systém |  |  |
| zatížitelnost | minimálně 100 kg |  |
| rozsahy izolace | dynamická 0,7 - 1000 Hz  pasivní nad 1000 Hz |  |

*Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku. Dodavatel dále doplní:*

**Výrobce:**

**Typové označení výrobků:**